

### 1.1.1. Laboratoire CReSTIC

#### 1.1.1.1. Résumé

<b><u>Nom du laboratoire</u></b>	Centre de Recherche en Sciences et Technologie de l'Information (EA3804)
<b><u>Adresse complète</u></b>	UFR Sciences, Moulin de la Housse BP1039, 51687 Reims cédex
<b><u>Directeur du laboratoire</u></b>	Mickael KRAJECKI
<b><u>Section CNRS</u></b>	7 et 8.
<b><u>Contact scientifique</u></b>	Damien ZANDER, <a href="mailto:damien.zander@univ-reims.fr">damien.zander@univ-reims.fr</a>
<b><u>Objectifs</u></b>	Etudes et caractérisation électrique des interfaces.
<b><u>Site web</u></b>	<a href="http://crestic.univ-reims.fr/">http://crestic.univ-reims.fr/</a>

#### 1.1.1.2. Domaines de compétences

- Caractérisation de Transistors
- Jonction Métal-Isolant-Semi-conducteur organique-Métal.
- Etudes de phénomènes de piégeage.
- Etude du stress en tension

#### 1.1.1.3. Personnels permanents impliqués

- Bruno Grouiez, IGR, [bruno.grouiez@univ-reims.fr](mailto:bruno.grouiez@univ-reims.fr)
- Damien Zander, MCF, [damien.zander@univ-reims.fr](mailto:damien.zander@univ-reims.fr)

#### 1.1.1.4. Publications significatives (10 max)

R. Ledru, S. Pleutin, B. Grouiez, D. Zander, H. Bejbouji, K. Lmimouni, D. Vuillaume, *Low frequency dielectric loss of metal/insulator/organic semiconductor junctions in ambient conditions*, Organic Electronics, Vol 13, Issue 10, 2012.

R. Ledru, S. Pleutin, B. Grouiez, D. Zander, H. Bejbouji, K. Lmimouni and D. Vuillaume, *Reliability studies of pentacene based thin film transistors*, MRS Proceedings, Volume 1435, 2012.

C. Petit, **D. Zander**, K. Lmimouni, M. Ternisien, D. Tondelier, S. Lenfant and D. Vuillaume, *Gate pulse electrical method to characterize hysteresis phenomena in organic field effect transistor*, Organic Electronics, Vol 9, P 979-984, 2008.

C. Petit, **D. Zander**, K. Lmimouni, M. Ternisien, S. Lenfant, D. Vuillaume, *Interface states characterization by an admittance spectroscopy technique in Pentacene MIS capacitors*, 10th European Conference on Molecular Electronics (ECME10), Copenhagen, 9-12 septembre 2009, France.

R. Ledru, **D. Zander**, B. Grouiez, K. Lmimouni, D. Vuillaume, G. Gelle, *Admittance model of Metal/Insulator/Organic Semiconductor capacity*, International Conference on Organic Electronic (ICOE 2010), 22-25 juin 2010, Université Paris Diderot, Paris.

**D. Zander**, K Lmimouni, B. Grouiez, R. Ledru, S. Lenfant and D. Vuillaume, *Frequency response of Metal/Insulator/Organic-semiconductor/Metal structure. Influence of the Self Assembled Monolayer*, 5th international meeting on molecular electronic (ELECTMOL'10), 6-10 décembre 2010, Grenoble.

